

HITACHI S5200

RESUMEN

CATEGORÍA Microscopio Electrónico de Barrido de alta Resolución.

TÉCNICAS

- Microscopía electrónica de barrido
- SE
- BSE

RESPONSABLES Francisco Varela

LOCALIZACIÓN Edificio CITIUS, Sótano, Ala Derecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máxima resolución entre puntos: 5 Å
- Tensión de trabajo: 0.1-30 kV
- Alto grado de automatización
- Inyectores:
 - Estándar
 - Sección Transversal
- Detectores:
 - E. Secundarios
 - E. Retrodispersados
- Análisis de imagen
- Adquisición digital de imágenes en formato TIF
- 3 Movimiento de la muestra motorizado